УДК 537.634.2

# МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ МАГНИТОУПРУГОЙ ДИНАМИКИ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛЕНКИ

© 2019 г. М. Ю. Дианов<sup>1, \*</sup>, Л. Н. Котов<sup>1</sup>, В. С. Власов<sup>1</sup>, В. Г. Шавров<sup>2</sup>, В. И. Щеглов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Сыктывкар, Россия <sup>2</sup>Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники Российской академии наук, Москва, Россия

> \**E-mail: dianovmy@yandex.ru* Поступила в редакцию 07.09.2018 г. После доработки 31.01.2019 г. Принята к публикации 27.06.2019 г.

Получена модель нелинейного возбуждения гиперзвука в трехслойной магнитной структуре при воздействии радиочастотного магнитного поля. Рассмотрены нелинейные уравнения магнитоупругости с учетом граничных условий и получена система нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Выявлены режимы прецессии вектора намагниченности второго порядка в слоях структуры, которые ранее наблюдались в случае одного ферритового слоя.

DOI: 10.1134/S0367676519100065

## введение

В настоящее время управление динамикой намагниченности при воздействии упругих волн на частотах до 500 ГГц является бурно развивающимся направлением магнитоакустики [1-6]. В недавних работах [1-6] было обнаружено сильное влияние динамики упругой подсистемы на магнитные колебания. Данная работа является логическим продолжением этих работ и посвящена решению задачи расчета магнитоупругой динамики в трехслойной пленке в наиболее общем нелинейном случае.

## ГЕОМЕТРИЯ ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

В работе рассматривается трехслойная пленка, состоящая из 3 магнитных слоев, толщина которых произвольна. Обозначим первый слой буквой *р*. второй и третий соответственно *d* и *r*. Толщины слоев будем обозначать теми же буквами. Систему отсчета выбираем в центре *d*-слоя, для простоты решения задачи. Постоянное магнитное поле  $\vec{H}$  направлено перпендикулярно плоскости пленки по оси z. Обшая толшина пленки выбиралась таким образом, чтобы во всю толщину пленки укладывалось половина длины упругой волны с частотой близкой к ферромагнитному резонансу (ФМР). Будем считать, что все слои обладают одинаковыми упругими свойствами. При этом магнитные и магнитоупругие свойства каждого слоя, в общем случае, различны. Переменное

магнитное поле было ориентировано в плоскости *ху* и обладает круговой поляризацией. Материалы структуры имеют кубическую кристаллографическую симметрию, плоскость (100) которая совпадает с плоскостью пластины.

Далее рассматриваем полную плотность энергии слоев пленки Uв поле  $\vec{H} = \{h_x; h_y; H_0\}$  как сумму плотностей энергий каждого слоя. В плотность энергии каждого слоя входит плотность магнитной, магнитоупругой, упругой энергий и энергии анизотропии. Для упрощения дальнейшего решения будем рассматривать только взаимодействие стоячих по толщине пленки поперечных упругих волн с ФМР. Тогда выражение для плотности энергии будет выглядеть следующим образом:

$$U = -M_0 h_x m_x - M_0 h_y m_y - M_0 H_0 m_z +$$
  
+  $2\pi M_0^2 m_z^2 + 2B_2 (m_z m_y u_{zy} + m_x m_z u_{xz}) +$   
+  $2C_{44} \left( u_{xy}^2 + u_{yz}^2 + u_{zx}^2 \right) + K_1 \left( m_x^2 m_y^2 + m_y^2 m_z^2 + m_z^2 m_x^2 \right) + K_2 m_x^2 m_y^2 m_z^2,$  (1)

где  $C_{44}$  — константа (модуль) упругости;  $B_2$  — константа магнитоупругого взаимодействия,  $m_i$  — компоненты единичного вектора намагниченности,  $M_0$  — намагниченность насыщения,  $u_{ik}$  — компоненты тензора деформации,  $K_1$ ,  $K_2$  — первая и вторая константы кубической анизотропии.

Для решения задачи будем использовать уравнение Ландау—Лифшица с релаксационным членом в форме Гильберта и уравнение для упругих



**Puc. 1.** Прецессионные портреты намагниченности в разных слоях трехслойной структуры. Амплитуда переменного магнитного поля h = 1 Θ (a), 20 Θ (6).  $4\pi M_{0d} - H_0 = 0$  Θ.  $H_0 = 1800$  Θ.  $4\pi M_{0p} = 1750$  Гс;  $4\pi M_{0d} = 1800$  Гс;  $4\pi M_{0r} = 1850$  Гс;  $\alpha = 0.1$ ;  $B_2 = 13.92 \cdot 10^6$  эрг · см<sup>-3</sup>.

Х

смещений *u<sub>i</sub>*. Рассмотрим граничные условия. Механические напряжения и упругие смещения на границе между слоями равны. На границе с воздухом нормальные компоненты напряжений равны нулю. Граничные условия для намагниченности не нужны в силу однородности прецессии. Далее разделим решение для упругого смещения на 2 части, однородную и неоднородную:

$$u_x(z,t) = U_x(z,t) + v_x(z,t),$$
 (2)

где  $v_x(z,t)$  — часть, удовлетворяющая однородным граничным условиям (на внешних границах  $\partial v/\partial z = 0$ ). На внутренних границах между слоями выполняется равенство функций *v*, а так же производных  $\partial v/\partial z$  соседних слоев. *U* — неоднородная часть, для которой выполняется условие  $\partial^2 U/\partial z^2 = 0$  по всей толщине пленки, включая границы.

Далее будем рассматривать *p*-слой пленки. Разложим однородную часть по собственным функциям граничной задачи по всей толщине слоя, для того чтобы избавиться от координатной зависимости. В результате получим:

$$v_{px}(z,t) = v_{0px}(t) + \sum_{n=1}^{\infty} v_{pn}(t) \cos\left(\frac{\pi n}{p}z + \frac{\pi n}{p}\frac{d}{2}\right).$$
 (3)

Для  $v_{1px}(t)$ ,  $v_{0px}(t)$  путем подстановки (3) в уравнения магнитоупругости с использованием выражения для *U*, получаем дифференциальные уравнения:

$$\frac{d^{2}v_{1x}}{dt^{2}} + 2\beta \frac{dv_{1x}}{dt} + \frac{c_{44}}{\rho} \frac{\pi^{2}}{p^{2}} v_{1x} = 
= -\frac{4p}{\pi^{2}} \left( \frac{d^{2}}{dt^{2}} + 2\beta \frac{d}{dt} \right) \left( -\frac{B_{p2}}{c_{44}} m_{px} m_{pz} \right), \qquad (4) 
\left( \frac{d^{2}}{dt^{2}} + 2\beta \frac{d}{dt} \right) \times 
\left( v_{0px}(t) + \frac{B_{p2}}{c_{44}} m_{px} m_{pz} + \frac{B_{d2}}{c_{44}} m_{dx} m_{dz} \right) = 0.$$

Для *у*-компоненты получаются аналогичные уравнения. Достаточно просто заменить в формулах индекс *x* на *y*. Такие же выкладки повторяем и для остальных двух слоев. Таким образом, получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений, включающую в себя уравнение Ландау—Лифшица—Гильберта, а так же уравнения типа (4), (5) для *x*, *y*-компонент упругого смещения для всех трех слоев. Для решения системы применяли метод Рунге—Кутта 4—5 порядка. Частоту переменного поля выбирали равной частоте упругого резонанса в пленке.



**Puc. 2.** Прецессионные портреты намагниченности в разных слоях трехслойной структуры. Амплитуда переменного магнитного поля h = 1 (a), 20 Θ (b).  $4\pi M_0 - H_0 = 5$  Θ.  $H_0 = 1750$  Θ.  $4\pi M_0 = 1755$  Гс;  $\alpha = 0.1$ ;  $B_{p2} = 13.92 \cdot 10^5$  эрг · см<sup>-3</sup>;  $B_{d2} = 13.92 \cdot 10^6$  эрг · см<sup>-3</sup>;  $B_{r2} = 13.92 \cdot 10^7$  эрг · см<sup>-3</sup>.

#### ДИНАМИКА МАГНИТОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ

Была построена динамика магнитных и упругих колебаний во времени и прецессионные портреты намагниченности в слоях трехслойной структуры при разных значениях материальных параметров и амплитуд внешних полей. Основные параметры материала пленки были близки к параметрам для ЖИГ. Наиболее интересная динамика наблюдалась в случае, когда внешнее постоянное поле было близко к полю размагничивания  $H_0 \sim 4\pi M_i$ . В этом случае были выявлены режимы прецессии второго порядка [7], которые ранее наблюдались для одного ферритового слоя в работах [7, 8]. На рис. 1 показаны прецессионные портреты намагниченности в слоях пленки при различных значениях намагниченности насыщения слоев, при двух разных значениях амплитуды переменного поля. Обнаружены режимы прецессии положения равновесия без охвата центра (в слоях d и r) и с охватом центра (в слое p). На рис. 2 показаны прецессионные портреты намагниченности в слоях пленки при сильно различающихся значениях констант магнитоупругости слоев. На рис. 2а для слоя р наблюдается стремление намагниченности ориентироваться в положение новой легкой оси, отличной от нормали к плоскости пленки. Это явление возникает в материале с большими значениями константы магнитоупругости [9].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №№ 17-02-01138, 17-57-150001).

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Janusonis J., Chang C.L., Jansma T. et al.* // Phys. Rev. B. 2016. V. 94. Art. № 024415.
- 2. Chang C.L., Lomonosov A.M., Janusonis J. et al. // Phys. Rev. B. 2017. V. 95. Art. № 060409.
- Dreher L., Weiler M., Pernpeintner M. et al. // Phys. Rev. B. 2012. V. 86. Art. № 134415.
- 4. *Thevenard L., Gourdon C., Prieur J.Y. et al.* // Phys. Rev. B. 2014. V. 90. Art. № 094401.
- Kuszewski P., Camara I.S., Biarrotte N. et al. // J. Phys. Cond. Matt. 2018. V. 30. № 24. Art. № 244003.
- *Linnik T., Scherbakov A., Yakovlev D. et al.* // Phys. Rev. B. 2011. V. 84. Art. № 214432.
- 7. *Власов В.С., Котов Л.Н., Шавров В.Г., Щеглов В.И.* // Радиотехн. и электрон. 2011. Т. 56. № 9. С. 1120.
- 8. *Власов В.С., Кирушев М.С., Котов Л.Н. и др.* // Радиотехн. и электрон. 2013. Т. 58. № 9. С. 857.
- 9. Власов В.С., Котов Л.Н., Шавров В.Г., Щеглов В.И. // Радиотехн. и электрон. 2010. Т. 55. № 6. С. 689.